

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 10 月 23 日 (23.10.2003)

PCT

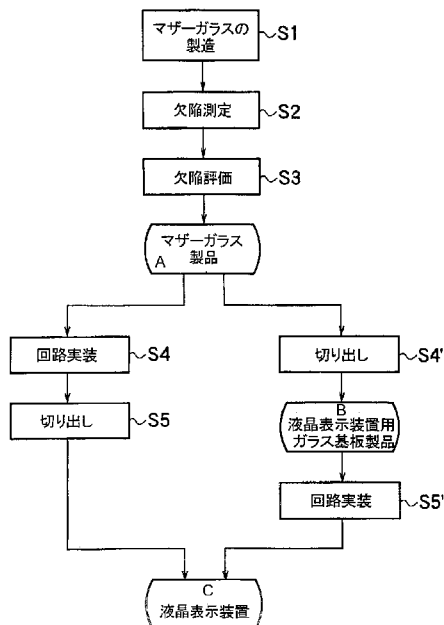
(10) 国際公開番号
WO 03/087923 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G02F 1/1333, G01M 11/00 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP03/04216 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 大屋 嘉孝
(22) 国際出願日: 2003 年 4 月 2 日 (02.04.2003) (OYA, Yoshitaka) [JP/JP]; 〒222-0033 神奈川県 横浜市
(25) 国際出願の言語: 日本語 港北区 新横浜 2 丁目 1 2 番 2 0 エヌエッチ・テク
(26) 国際公開の言語: 日本語 ノグラス株式会社内 Kanagawa (JP).
(30) 優先権データ: 特願2002-101593 2002 年 4 月 3 日 (03.04.2002) JP (74) 代理人: 阿仁屋 節雄, 外 (ANIYA, Setuo et al.); 〒
102-0072 東京都 千代田区 飯田橋 4 丁目 6 番 1 号 21 東和
ビル 3 階 Tokyo (JP).
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): エヌエッ (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
チ・テクノグラス株式会社 (NH TECHNO GLASS BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
CORPORATION) [JP/JP]; 〒222-0033 神奈川県 横浜 DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
市港北区 新横浜 2 丁目 1 2 番 2 0 Kanagawa (JP). ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO,
NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ,

[続葉有]

(54) Title: LIQUID CRYSTAL DISPLAY UNIT-USE GLASS SUBSTRATE AND METHOD OF PRODUCING MOTHER GLASS AND MOTHER GLASS INSPECTION DEVICE

(54) 発明の名称: 液晶表示装置用ガラス基板及びそのマザーガラスの製造方法並びにマザーガラス検査装置



S1...PRODUCTION OF MOTHER GLASS
S2...MEASUREMENT OF DEFECTS
S3...EVALUATION OF DEFECTS
A...MOTHER GLASS PRODUCT
S4...CIRCUIT MOUNTING
S4'...CUTTING
S5...CUTTING
B...GLASS SUBSTRATE PRODUCT FOR LIQUID CRYSTAL
DISPLAY UNIT
S5'...CIRCUIT MOUNTING
C...LIQUID CRYSTAL DISPLAY UNIT

(57) Abstract: Yields with which to produce a mother glass and a liquid crystal display unit-use glass substrate can be enhanced, and the costs of a mother glass and a liquid crystal display unit-use glass substrate can be lowered. A method of producing a mother glass satisfying a specified quality standard by producing and selecting a mother glass capable of being obtained by cutting a liquid crystal display unit-use glass substrate according to specified cutting arrangement information, the method comprising the defect measuring step S2 of measuring defects present in the produced mother glass to determined defect information including the position information of the defects, and the defect evaluation step S3 of evaluating quality information determined from the defect information and the cutting arrangement information by specified evaluation criteria to evaluate the quality of the mother glass.

(57) 要約: マザーガラスや液晶表示装置用ガラス基板製造の歩留まり向上を可能にしてガラス資源をより有効に利用することを可能にし、マザーガラス及び液晶表示装置用ガラス基板の低コスト化を可能にする。 所定の切り出し配置情報にしたがって液晶表示装置用ガラス基板を切り出して得ることのできるマザーガラスを製造して選別することにより、所定の品質基準を満たすマザーガラスを製造するマザーガラスの製造方法であって、前記製造されたマザーガラスに存在する欠陥を測定して該欠陥の位置情報を含む欠陥情報を求める欠陥測定工程 S2 と、前記欠陥情報と前記切り出し配置情報とから定まる品質情報を所定の評価基準により評価して、前記マザーガラスの品質を評価する欠陥評価工程 S3 とを有する。

WO 03/087923 A1



TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
ZM, ZW.

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。